

Journal of Electrochemistry

Volume 15 | Issue 3

2009-08-28

Ellipsometric Study on Colored Electroplating of Cuprous Oxide on Ni Substrate

Xue-song FENG

Jing-lei LEI

Ai-xiang CHEN

Wan-shan YIN

Ling-jie LI

Sha ZHENG

Hui ZHAO

See next page for additional authors

Recommended Citation

Xue-song FENG, Jing-lei LEI, Ai-xiang CHEN, Wan-shan YIN, Ling-jie LI, Sha ZHENG, Hui ZHAO, Shao-yan PAN. Ellipsometric Study on Colored Electroplating of Cuprous Oxide on Ni Substrate[J]. *Journal of Electrochemistry*, 2009 , 15(3): 310-314.

DOI: 10.61558/2993-074X.2001

Available at: <https://jelectrochem.xmu.edu.cn/journal/vol15/iss3/15>

Ellipsometric Study on Colored Electroplating of Cuprous Oxide on Ni Substrate

Authors

Xue-song FENG, Jing-lei LEI, Ai-xiang CHEN, Wan-shan YIN, Ling-jie LI, Sha ZHENG, Hui ZHAO, and Shao-yan PAN

Corresponding Author(s)

文章编号: 1006-3471(2009)03-0310-05

镍基彩色电沉积 Cu₂O 椭圆偏振光谱研究

封雪松^{1,2}, 雷惊雷^{1*}, 陈爱祥¹, 阴宛珊¹, 李凌杰¹,
郑莎¹, 赵辉¹, 潘少彦¹

(1 重庆大学化学化工学院, 重庆 400044; 2 四川理工学院材料与化学工程学院, 四川自贡 643000)

摘要: 应用电化学方法在 Ni 基底上沉积 Cu₂O 彩色膜层以期提高装饰效果。X 光电子能谱 (XPS)、扫描电子显微镜 (SEM) 和能量色散谱 (EDS) 测试表明, 膜层由 Cu₂O 组成, 沉积层光滑平整, 且 Cu₂O 层均匀覆盖 Ni 基底。椭圆偏振光谱表征不同沉积时间的膜层, 提出膜层内存在由 N 逐渐变为 Cu₂O 的过渡层, 建立“空气—Cu₂O 层—过渡层—Ni 基底”4 层膜模型, 并借助梯度有效介质近似解析椭圆偏振光谱, 得到不同沉积时间的膜层厚度以及厚度随时间线性增长关系。

关键词: 表面处理; 彩色电沉积; Cu₂O; 椭圆偏振光谱法; 有效介质近似

中图分类号: O646.541

文献标识码: A

电镀 Ni 结晶细致, 耐磨性好, 易得镜面光泽镀层, 但 Ni 呈银白色, 色彩单调, 可再镀 Cu 着色。电化学着色方法是在基底上沉积一定厚度的氧化物膜层或盐膜层, 由光的干涉作用而显色^[1]。颜色主要决定于沉积膜层的组成及厚度。受电沉积过程中物质浓度、pH 值、温度、电流密度以及沉积时间等条件制约, 镀层色彩不易重现且色泽不匀^[2]。目前针对上述不足已有不少研究^[3-6], 但尚未充分认识精确控制沉积膜层厚度的重要性。

若应用反射式椭圆偏振光谱分析光学参量 Δ 和 Ψ , 得知椭圆偏振光被膜层反射后偏振状态的改变, 可确定膜层光学常数 (折射系数 n 、吸光系数 k) 和厚度^[7-9]。本文借助反射式椭圆偏振光谱精确测定 Ni 基底上 Cu 彩色沉积层的厚度, 研究沉积层厚度随电沉积时间的变化规律, 可深入了解 Ni 基电化学着色机理, 优化电化学着色工艺。

1 实验

普通碳钢片 (2.0 cm × 2.0 cm × 0.1 cm) 作基片, 依次以 200、400、800、1200# 水砂纸逐级打磨至镜面, 水洗、除油、活化、镀光亮 Ni (普通 Watt 槽, 电流密度 1.00 A/dm², 45.0 °C, 25 min)、水洗、活化、电化学着色 (镀液 CuSO₄ 37 g/L NaOH 45 g/L

食糖 90 g/L, 37.0 °C, 恒电流)。

使用 M2000U 椭圆偏振光谱仪 (美国 J.A. Wollam) 作反射式椭圆偏振光谱测量, 波长 600~1000 nm, 入射角 70°, 数据解析采用仪器自带 WVASE32 程序。

使用带能量色散谱 (EDS) 探头的 VEGA II LMU 扫描电子显微镜 (SEM, 捷克 TESCAN) 观察样品形貌、分析表面元素。

使用 ESCALAB250 光电子能谱仪 (XPS, 美国 Thermo Fisher Scientific) 测定元素价态。

2 结果与讨论

2.1 SEM 及 EDS

实验表明, 在电流密度 0.04~0.16 A/dm², 沉积时间 300 s 内, Ni 基电沉积 Cu₂O 层颜色随时间由“金黄→紫→蓝→绿→金黄”顺序循环改变, 色泽均匀鲜艳。图 1 为光亮 Ni 基底 (a) 及其着色样品 (b) (电流密度 0.16 A/dm², 沉积时间 120 s) 的 SEM 照片。总体上, 光亮 Ni 镀层及着色层表面均很平整, 但 Ni 镀层有少量针孔。

根据 EDS 分析, 图 2 示出对应于图 1b 样品内 Ni (a) 和 Cu (b) 的元素分布 (图中黑点), 可以发

现, Ni和 Cu分布十分均匀, 并且可认定着色层均匀覆盖光亮 Ni基底。EDS进一步分析表明, 该膜层表面主要含 Ni(84.36%), Cu(6.48%), O(4.03%), Fe(2.62%)以及 C(2.51%)等元素。其中 Fe Ni分别来自于基底和 Ni层, Cu来自着色

层。另据 XPS实验(图3), 沉积层中 Cu元素 2P_{3/2}及 2P_{1/2}峰位置和 CuLM2俄歇峰位分别为 932.6、952.4和 916.3 eV, 表明电沉积产物成分主要为 Cu₂O^[10]。

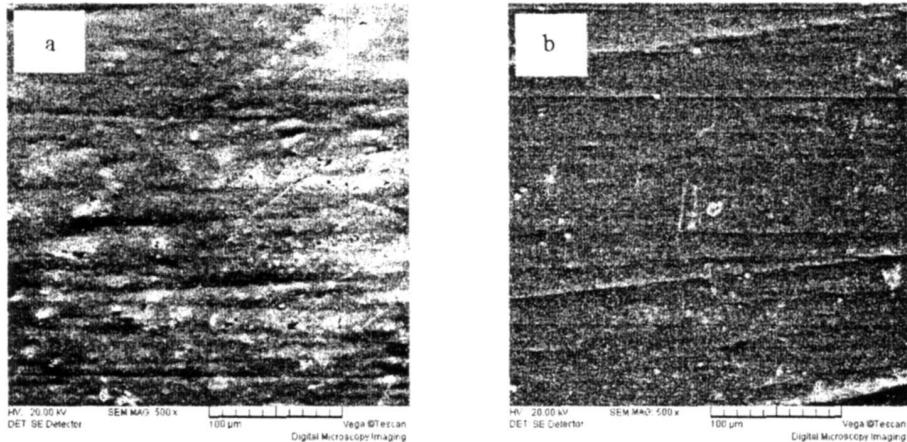


图 1 Ni层 (a)和电沉积 Cu₂O着色层 (b)SEM照片

Fig 1 SEM images of the Ni substrate (a) and colored electropainting Cu₂O coating (b)

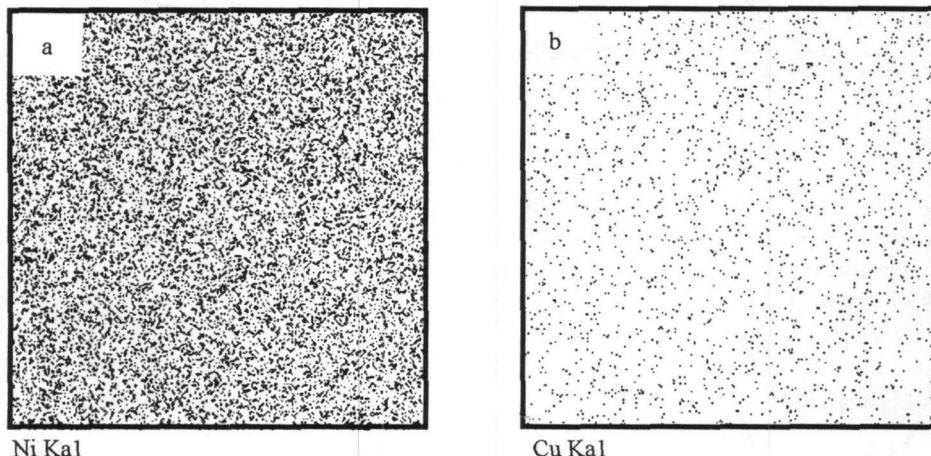
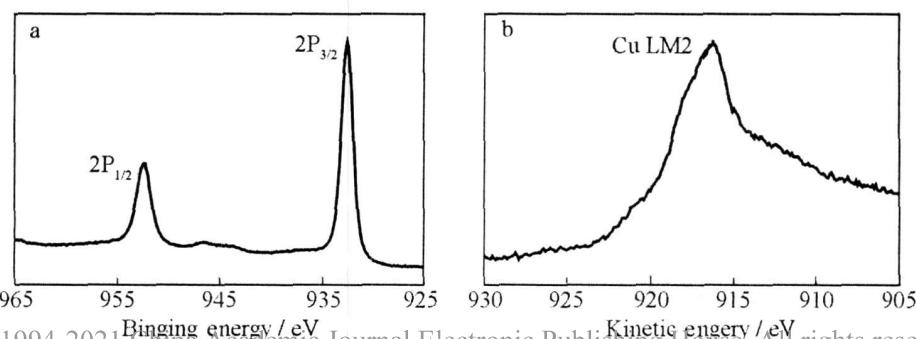


图 2 Ni基 Cu₂O着色层(见图 1b样品)内 Ni(a)和 Cu(b)元素分布(图中黑点)

Fig 2 Ni(a) and Cu (b) element mapping distribution (shown as dots) for the colored electropainting coating of Cu₂O on Ni substrate (sample as Fig 1b)



2.2 反射式椭圆偏振测试

在 0.09 A/dm^2 电流密度下, 每 30 s 记录样品颜色(见表 1), 由反射式椭圆偏振光谱检测样品光学参量 Δ 和 Ψ 随波长 λ 的改变(如图 4)。依据“环境—膜层—基底”3 层膜模型^[7]构建“空气— Cu_2O 层—Ni 基底”光学模型(图 5a)。计算表明,

表 1 Ni 基 Cu_2O 着色层颜色随沉积时间的变化
Tab. 1 Variation of color with electropating time for the electropating coating of Cu_2O on Ni substrate

No	1	2	3	4	5	6
Electropating time/s	60	90	120	150	180	210
Color	Yellow green	Gold	Purplish red	Emerald	Purplish red	Dark green

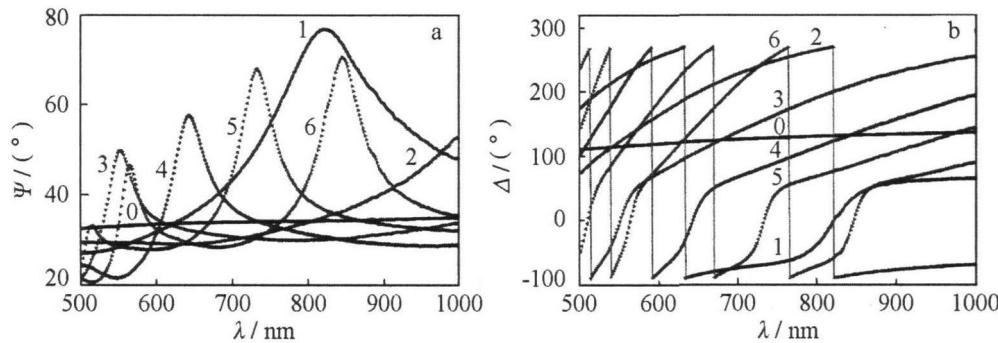


图 4 不同沉积时间 Ni 基 Cu_2O 着色层的椭圆偏振实验结果 a $\Psi \sim \lambda$ 曲线, b $\Delta \sim \lambda$ 曲线

Fig. 4 Ellipsometric experimental data corresponding to different electropating times ($0 \sim 6/\text{s}$, 0, 60, 90, 120, 150, 180) for the electropating coating of Cu_2O on Ni substrate
a $\Psi \sim \lambda$ curves b $\Delta \sim \lambda$ curves

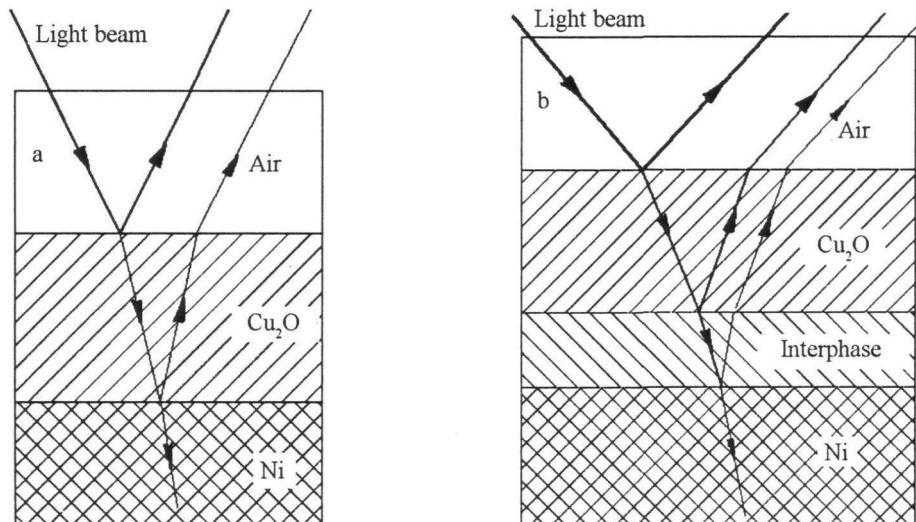


图 5 (C) 1994-2001 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

Fig. 5 3-layer (a) and 4-layer (b) optical models for deconvoluting ellipsometric data

此模型不能很好符合实验结果, 例如表 1 中 2# 样品(沉积时间为 90 s), 其理论 $\Psi \sim \lambda$ 曲线(图 6a 实线)与实验曲线(图中离散点)仅变化趋势相近。这可能是 3 层膜模型较粗糙, 只反映了体系的主要特征而没体现更多细节。

若考虑 Ni基底的微观不平整性, Ni基底与 Cu₂O间可能存在一层较薄的过渡层, 其组成由 Ni逐渐变化为 Cu₂O, 则上述光学模型需修正为“空气—Cu₂O层—过渡层—Ni基底”4层膜模型(图5b). 借助梯度膜模型模拟过渡层内 Ni含量的逐渐改变(由 100%至 0), 并应用有效介质近似(Effective Medium Approximation 简称 EMA)^[8-9]计算过渡层的光学常数, 4层膜模型可较好地解析椭圆偏振实验数据(6个样品, 见表 2). 图 6给出沉积时间为 90 s(表 2中 2#样品)的理论 $\Psi \sim \lambda$ (a)和 $\Delta \sim \lambda$ (b)曲线(图中虚线), 可见其与实验数据(图中离散点)符合较好. 另外, 尝试以 Cu层或 CuO层代替 Cu₂O层的多个光学模型, 都不能与实验数据符合, 进一步表明彩色沉积层的主要组成确实为 Cu₂O.

以膜的总厚度 T_{total}(过渡层与 Cu₂O层厚度之和)对沉积时间 t作图, 得出沉积层总厚度随时间线性增长, 其线性方程为:

$$T_{\text{total}} = 1.135t - 4.429 \quad (R^2 = 0.994)$$

据此, 即可由沉积时间及电流效率计算相应的膜层厚度, 继而依据薄膜干涉以及色度学^[11-12]原理预测膜的颜色变化, 确定颜色与膜厚度的对应关系, 再由膜厚增长公式计算某一特定颜色所需要的沉积时间, 从而可在工艺上实现膜颜色的精确控制.

3 结 论

电沉积 Cu对 Ni基底着色, 着色层主要成分为分布均匀的 Cu₂O; 借助组成逐渐变化的有效介质

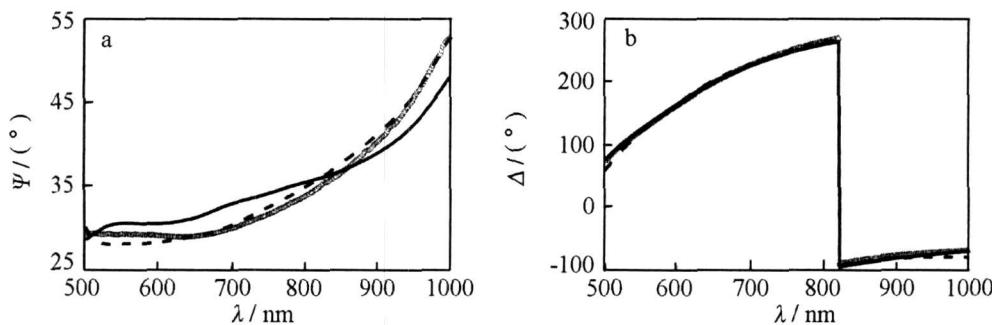


图 6 2#样品理论(实线: 3层膜模型, 虚线: 4层膜模型)曲线与实验曲线(离散点)
a $\Psi \sim \lambda$ 曲线, b $\Delta \sim \lambda$ 曲线(3条 $\Delta \sim \lambda$ 曲线几乎重合)

Fig 6 Experimental data and fitted curves (solid: 3-layer model dash: 4-layer model) of the 2# sample
a $\Psi \sim \lambda$ curves b $\Delta \sim \lambda$ curves the three $\Delta \sim \lambda$ curves in (b) are almost overlapped

表 2 由椭圆偏振光谱数据计算的不同沉积时间的 Ni基 Cu₂O着色层厚度

Tab 2 Coating thickness of Cu₂O on Ni substrate corresponding to various electropating time calculated from ellipsometric data

No	Electroplating time / s	Thickness/nm		
		Interphase	Cu ₂ O layer	Total
1	60	15.33	62.70	78.03
2	90	15.79	97.41	113.20
3	120	19.25	135.37	154.62
4	150	20.07	164.10	184.17
5	180	19.92	211.28	231.20
6	210	24.89	252.62	277.51

光学模型,很好解析着色层的椭圆偏振光谱并精确求得着色层厚度,发现沉积速率与时间成正比.

致谢:本研究工作得到了重庆大学大型仪器设备开放基金项目资助,特此感谢!

参考文献 (References):

- [1] WU Tian-cai (吴天才). Electroplating of colored films [J]. Electroplating and Finishing (in Chinese), 1994, 13(2): 1-4.
- [2] HE Sheng-long (何生龙). Techniques of colored electroplating [M]. Beijing Chemical Industry Press 2007. 4.
- [3] WANG Quan-fa (汪泉发). Electrolytic coloring of copper [J]. Electroplating and Pollution Control (in Chinese), 1988, 8(5): 10-11.
- [4] XU Shu-kai (许书楷), YANG Fang-zu (杨防祖), GE Fu-yun (葛福云), et al. Prepare and structure of electrodeposited color chromium coatings [J]. Electroplating and Pollution Control (in Chinese), 1992, 11(6): 13-17.
- [5] ZHENG Fu-yang (郑辅养), MA Ting-chun (马廷椿), WEN Guomou (温国谋). Coloring of plating copper [J]. Materials Protection (in Chinese), 1997, 30(9): 18-19.
- [6] LUN Chun-hui (梁春晖), XUE Yong-qiang (薛永强), HAN Xiu-juan (韩秀娟). Molybdate electrolytic coloring on nickel coating [J]. Materials Protection (in Chinese), 1999, 32(8): 11-13.
- [7] Azzam R M A, Bashara N M. Ellipsometry and polarized light [M]. Amsterdam: North Holland Publishing Comp 1977. 283.
- [8] Aspnes D E, Kinsbrow E, Bacon D D. Optical properties of Au: sample effects [J]. Physical Review B, 1980, 21(8): 3290-3299.
- [9] LEI Jing-lei (雷惊雷), LI Ling-jie (李凌杰), ZHANG Sheng-tao (张胜涛), et al. Studies on corrosion behavior of copper electrode in weak alkaline solution [J]. Acta Chimica Sinica (in Chinese), 2001, 59(8): 1216-1221.
- [10] WANG Jian-qi (王建琪), WU Wen-hui (吴文辉), FENG Da-ming (冯大明). Introduction on XPS/XAES/UPS [M]. Shanghai National Defense Industry Press 1992. 530.
- [11] MU Guo-guang (母国光), ZHAN Yuan-ling (战元龄). Optics [M]. Beijing Peoples' Educations Press 1979. 190.
- [12] QI Tong-fei (戚同非), WU Yong-gang (吴永刚), LIN Xiao-yan (林小燕), et al. Computer simulation for change of reflected color in film thickness control process [J]. Vacuum (in Chinese), 2005, 42(1): 28-32.

E llipsometric Study on Colored E lectroplating of Cuprous O xide on Ni Substrate

FENG Xue-song^{1,2}, LEI Jing-lei^{1*}, CHEN Ai-xiang¹, YIN Wan-shan¹, LI Ling-jie¹, ZHENG Sha¹, ZHAO Hui¹, PAN Shao-yan¹

(1. College of Chemistry and Chemical Engineering Chongqing University Chongqing 400044, China)

2. Department of Material and Chemical Engineering Sichuan University of Science and Engineering

Zigong 643000, Sichuan China)

Abstract: The colored Cu₂O coating was electroplated on Ni substrate to meet the decorative requirements. Results of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) indicate the coating consisting of Cu₂O. Images of scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) show that the Cu₂O coating is smooth and uniform, and covers the Ni substrate wholly. Ellipsometric measurements for Cu₂O coatings with various electroplating time were carried out. Using a 4-layer model of "Air-Cu₂O layer-interphase-Ni", the interphase was modeled with the graded effective medium approximation (EMA), the ellipsometric data were deconvoluted and the Cu₂O coatings thickness of Cu₂O was obtained. Results reveal that the Cu₂O coating thickness increases linearly with the electroplating time.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

Key words: surface treatment colored electroplating cuprous oxide ellipsometry effective medium approximation